⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭57-42175

f) Int. Cl.³
 H 01 L 31/10
 27/14

識別記号

庁内整理番号 7021-5F 7021-5F

❸公開 昭和57年(1982) 3月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈赤外線検知装置

②)特

願 昭55—117920

②出 願 昭55(1980) 8 月26日

⑫発 明 者 濱嶋茂樹

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑫発 明 者 瀧川宏

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

79発 明 者 吉河満男

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑫発 明 者 伊藤道春

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑫発 明 者 上田知史

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 人 弁理士 井桁貞一

明 細 曹

1. 発明の名称

赤外線検知装置

2. 特許請求の範囲

(I) 赤外線検知素子と該検知素子の出力信号処 理用の回路素子とをたがいに対向させ、両者を、 金属層を介して間看し一体化した光電変換装置 において、上記赤外線検知素子の光電変換領域 の裏面に凹所を設け、入射した赤外線が該凹所 を通つて上記光電変換領域に到達するようにし たことを特徴とする赤外線検知装順。

- (2) 基板の片側表面に複数の赤外線検知素子を 形成し、該基板において他の片側表面の各赤外 線検知業子に対応する部位に凹所を散けたこと を特徴とする特許請求の範囲第(1)頃に記載の赤 外線維知装備。
- (3) 赤外線検知素子の光電変換頭域が基板表面 に形成されたメサ内にあることを特徴とする特 許請求の範囲第(1)頃に記載の赤外線検知装置。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は赤外線検知装置とく 化光電変換素子と 信号処理回路とを一体化した赤外線検知装置の製 借方法に関するものである。

赤外線領域で動作する光電変換素子すなわち赤 外線検知素子と、該検知素子の出力信号を処理す る増幅器等の信号処理削略とを一体化する場合、 億力小型化するために両者を、金属バンプを介し て互いに対同した状態で適者することが緩々行わ れる。このようにして構成された赤外線検知素子 に対して検知すべき赤外線を入射させる場合には、 み赤外線検知素子の裏面(信号処理削略と対測し ていない側の面)側から入射させる。この点を、 わかり場くするために第1図によつて説明する。

第1 図において赤外線検知部分1 は共通の基板 1 0 の片側主装面に複数のメサ11~14を形成し、 各メサの頂面からある深さまでを逆襷電型層11a ~14a にしたものである。各個のメサが1 個の赤 外線検知業子として鳴くから、赤外線検知部分1 を以後集合体と呼ぶことにする。

2 はシリコン(Si)から成る基板20を有する信

号処理用集積回路業子であつて、21~24は基 放20と逆導電型の能動領域(たとえば電界効果 トランジスタのソース領域)であり、基成20の 表面は上記各能動領域の直上部を除き全面二酸化 シリコン(SiO_r) から成る破膜3により獲われて いる。

前記の集合体1と、集積回路業子2との接続は 金属バンプ4a~4dによつて行われている。す なわち集合体のメサ11~14の各個と、集積回 路素子2中の能動態域21~24の各個とは低機 点金属たとえばインジウム(In)から成る柱状 のバンプ4a~4dによつてそれぞれ接着されて むり、上記各バンプが機械的結合と電気的接続と を兼ねていて、こうすることにより集合体1と集 積回路業子2とは一体化されるとともに、集合体 1の各メサに生じた超気倍分が集積回路素子2に 入力される。

第1 図に示した構造から明らかなように、 検知 すべき赤外線の入射は図の上側から、すなわち集 合体1 のメサのない表面側から矢印で示すように

の部分は同一符号で示す。

男2図は本発明に係る赤外線微知装置の一実施 側電道を示したもので、本実施例においては集合 体1の基板10において、各メサ11~14の要 側に触列により凹所31~34がそれぞれ設けられている。上配各凹所の低から各メサの頂面まで の距離yは十数μ加程度とする。上配各凹所以外 の部分における基板10の厚さりはおよそ50μ 加である。この程度であれば基板10の機械的強 波は全体に且つて約50μ加程度の均一な厚さを 有する基板の場合とほとんど同等であつて、取扱 いに格別の困難はない。

上記の凹所を設ける際には30~40μmの深さまで馬板を触刻する必要があるので、この触刻を一工程で行えば側面離刻が生じ、このために暴板の分厚い部分の瞬が狭くなるおそれがある。このような事態を避けるためにはある深さたとえば20μmまで触刻を行なつた後一旦触刻を中止して触刻により生じた凹所の側壁を保護し、ついてさらに触刻を進めればよい。

行わざるを得ない。しかるに光電変換作用はほとんど各メサ11~14の内部において行われるから、入射した赤外線が上記各メサに到達する以前に集合体の基板10によつてかなり吸収される。 このため入射した光エネルギーのかなりの部分が信号に寄与せずに失われるという不都合がある。

さればとて、入射赤外線の吸収を減殺するため に基板10の厚さを大幅に減少させた場合には、 赤外線検知案子の溝成材料である多元半導体が機 候的に範弱なため上記基板がきわめて被指し易く なつて取扱いに利難をきたす。

本発明は前述の問題点を解決したもので、亦外 環
物知素子と信号処理用回路素子とを電気的に接 併するとともに接着して一体化し、かつ亦外環機 知素子の基板の回路素子と対回しない側の表面に 凹所を形成して該凹所を前じて赤外線を入射させ るようにした新規なる赤外線検知装置を提供せん とするものである。

以下図面を用いて本発射の実施例について詳細 に説明する。なお以下各図において第1図と同等

なお第2図においてSiから成る基板20を有する集積回路業子2は第1図に示したものと同一であるから、税明を省略する。また通常の集積回路の代わりに電荷転送業子(CCD,BBD等)を用いてもよい。

第3図は本発明の別の一実施例の複部構造を示したもので、本実施例では個々に分離された確知 素子のチップ41~44がサファイア板5に回着 されている。各チップの片側表面には逆導審皇籍 41a~44aが形成されているが、この表面は 平坦である。しかし上記迎導電型解41a等とは 同所31、~34、が形成されている。本実施例 の場合にも上記凹所31、~34、は入射赤外線 エネルギーの損失を防ぐ効果があり、かつ各側所 の場が不当に低くなるおそれはない。ちなみに移 実施例において検知素子またはメサの裏面に設け た凹所を、赤外線に対して充分透明度の高い物質 で充填することはなんら発支えない。

第1図

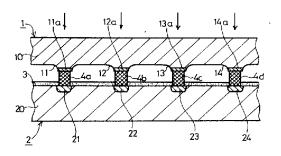
本発明に係る赤外線検知装置は集合体または間別の検知素子の馬板の機械的強度を低下させることをなく入射赤外線に対する損失を減少させることができるから、とくに多素子から成る総合体を信対処理用回路と一体化する助合に、取扱いを困難にすることなく高級関の提供を構成することができる優れた効果がある

4. 図面の簡単な説明

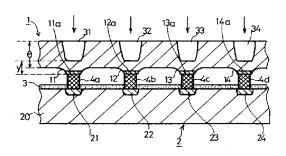
第1図は従来の赤外娘検知装置の要部構造を示す断面図、第2図は本発明に係る赤外線検知装置の一実施例構造を示す断面図、第3回は本発明に係る赤外線検知装置の他の一実施例構造を示す断面図である。

1: 赤外線機 知素千の集合体、2: 集積回路素 子、3: SiO, 被膜、4 a ~ 4 d: 急速バンプ、 31~34: 無刻により散けられた凹所、5: サ ファイア板、41~44: 検知業子チップ。

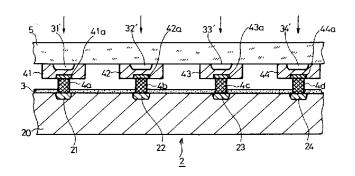
代理人 弁理士 井 桁 貞 一



第 2 図



第 3 図



PAT-NO: JP357042175A **DOCUMENT-IDENTIFIER**: JP 57042175 A

TITLE: INFRARED RAY DETECTOR

PUBN-DATE: March 9, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

HAMASHIMA, SHIGEKI TAKIGAWA, HIROSHI YOSHIKAWA, MITSUO ITO, MICHIHARU UEDA, TOMOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

FUJITSU LTD N/A

APPL-NO: JP55117920

APPL-DATE: August 26, 1980

INT-CL (IPC): H01L031/10, H01L027/14

US-CL-CURRENT: 228/180.22, 257/436, 257/447, 257/448, 257/

E27.122, 257/E31.127

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an highly sensitive device by having incoming infrared ray reaching a photoelectric convertion region of a detection element through a concave section provided on the back

thereof in an infrared ray detector in which the infrared ray detecting element is integrated with a circuit element for processing the output signal thereof.

CONSTITUTION: An SiO2 film 3 covers the surface of an integrated circuit element 2 made up of an Si substrate 20 having a plurality of active regions 21~24 and after windows are etched on the regions 21~24, columnar bumps 4a~4d comprising a low melting point such as In are mounted on the regions 21~24. Then, a plurality of mesa tops 11~14 provided on the rear surface of an assembly of infrared ray detecting element are fastened on the top of the bumps so that the assembly 1 is mechanically and chemically combined with the elements 2 through the bumps 4a~4d. Concave sections 31~34 are engraved on the back of the assembly corresponding to reverse conducting type layers 11a~14a provided in the mesa tops 11~14 of the assembly 1. Infrared rays is made incident to the concave sections while the majority of the infrared rays is contributed to the signals.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio